

259137

Form 3



259137

MEMORIA DESCRIPIVA

que se presenta para su inclusión en la colección

de

LIBROS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS

con el número de registro de julio de 1968, con el número 259.137

de

LIBROS DE LA BIBLIOTECA

por William Adams

de la obra de WILLIAM ADAMS, autor de "ELECTROPROCESOS", establecida en 2113 Forbes Street, Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos de América, por:

"CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE CALIFORNIA"

El presente libro describe los métodos y técnicas de la electroprocesión, la electroquímica, y la electroquímica en el campo de la química orgánica y la química inorgánica, así como la electroprocesión.

El libro describe los electroprocesos, como la electroquímica, la electroquímica, y la electroquímica, a través de un estudio detallado de los electroprocesos (como la electroprocesión) y los electroprocesos (como la electroprocesión), y los electroprocesos (como la electroprocesión), y los electroprocesos (como la electroprocesión).



El efecto de la separación de intervalos dieléctricos

El efecto de la separación de intervalos dieléctricos en un sistema de cables coaxiales, se puede estudiar considerando un sistema de cables coaxiales de tipo "cable de fibra" (fig. 1). Este tipo de cables se caracteriza por tener un diámetro exterior muy pequeño (del orden de milímetros) y un diámetro interior aún más pequeño (del orden de decenas de micrómetros). La separación de intervalos dieléctricos se logra mediante la introducción de un material dieléctrico de baja constante dieléctrica, que actúa como un aislante entre los conductores. A los efectos de este estudio se considerará un sistema de cables coaxiales con un diámetro exterior de 1 mm y un diámetro interior de 0.1 mm. El material dieléctrico utilizado será el aire, que tiene una constante dieléctrica de 1.0. El material conductor será el cobre, que tiene una constante dieléctrica de 1.0. El sistema de cables se alimentará con un voltaje de 100 V. El efecto de la separación de intervalos dieléctricos se estudiará mediante la medición de la capacitancia y la inductancia del sistema. Los resultados se discutirán en términos de la constante dieléctrica efectiva del sistema.

Por ejemplo, la separación de intervalos dieléctricos puede ser realizada mediante el uso de un material dieléctrico de baja constante dieléctrica, cuyo efecto es de reducir la capacitancia del sistema. Este efecto se puede estudiar mediante la medición de la capacitancia del sistema. El efecto de la separación de intervalos dieléctricos se estudiará mediante la medición de la capacitancia y la inductancia del sistema. Los resultados se discutirán en términos de la constante dieléctrica efectiva del sistema. El efecto de la separación de intervalos dieléctricos se estudiará mediante la medición de la capacitancia y la inductancia del sistema. Los resultados se discutirán en términos de la constante dieléctrica efectiva del sistema.

258137



... que en la zona de estudio se realizó un estudio de ...
 ... de Se ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...

ANEXO

... que en la zona de estudio se realizó un estudio de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...

- 20 17.- El método para excavar por debajo de las ...
 de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...
 ... de ... de ... de ... de ... de ...

- 30 18.- En el punto se ... el punto 18, ...

259137



Fig. 1

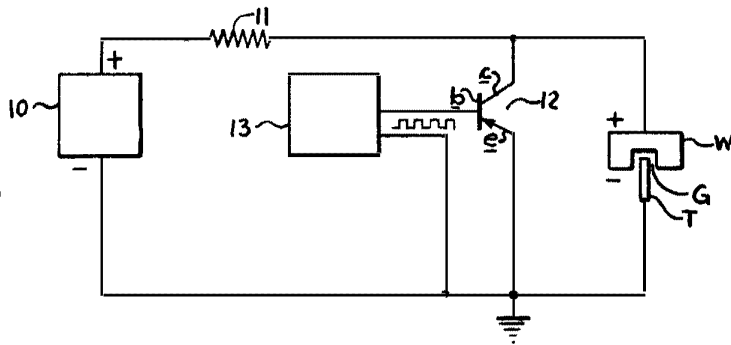


Fig. 2a

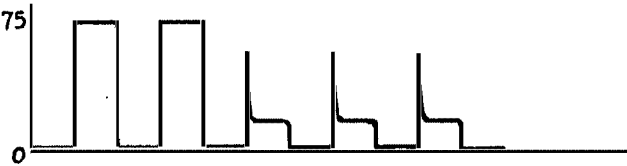


Fig. 2b

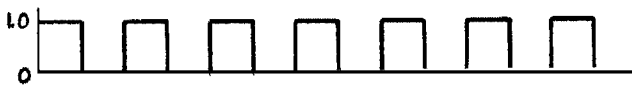


Fig. 2c

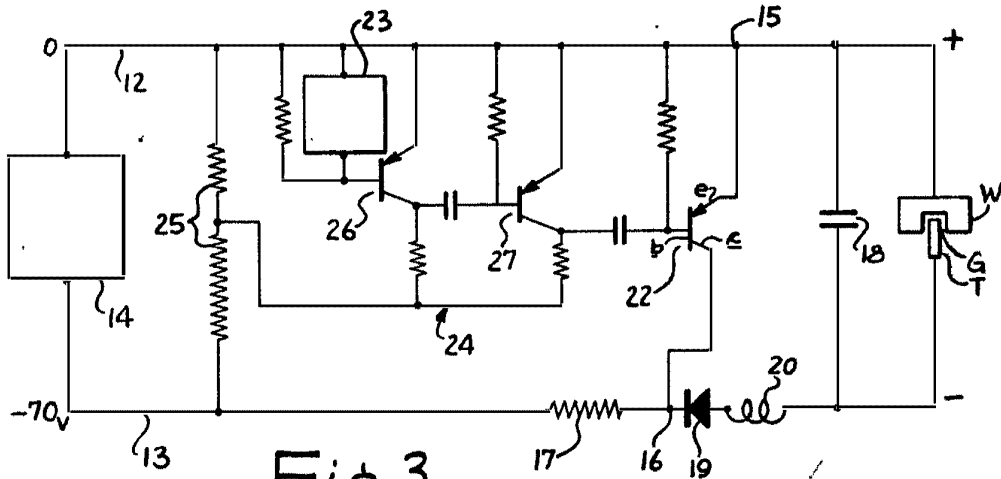
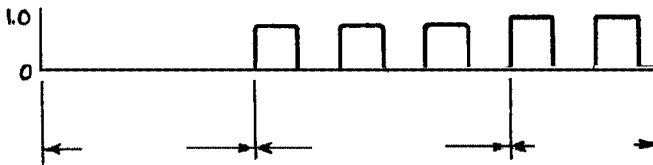


Fig. 3

259137

